日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2003年 1月10日

出 願 番 号

Application Number:

特願2003-004977

[ST.10/C]:

[JP2003-004977]

出 願 人 Applicant(s):

山一電機株式会社

2003年 3月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】 特許願

【整理番号】 3477-00

【提出日】 平成15年 1月10日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01R 33/76

【発明の名称】 半導体装置用ソケット

【請求項の数】 7

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込3丁目28番7号 山一電機株式会

社内

【氏名】 若林 良典

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込3丁目28番7号 山一電機株式会

社内

【氏名】 鈴木 威之

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込3丁目28番7号 山一電機株式会

社内

【氏名】 黒田 俊孝

【特許出願人】

【識別番号】 000177690

【氏名又は名称】 山一電機株式会社

【代理人】

【識別番号】 100077481

【弁理士】

【氏名又は名称】 谷 義一

【選任した代理人】

【識別番号】 100088915

【弁理士】

【氏名又は名称】 阿部 和夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013424

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9910479

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置用ソケット

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体装置の端子群に電気的に接続されるバンプ群を有し、 該半導体装置に対する信号の入出力を行なうコンタクトシートと、

前記半導体装置の端子を前記コンタクトシートのバンプ群に対し押圧する押圧 部材と、

前記押圧部材により前記半導体装置の端子が前記バンプ群に対し押圧されるとき、前記コンタクトシートにおける前記バンプ群の周辺の沈下を抑制する方向に、該コンタクトシートを押圧するコンタクトシート押圧部材と、

を具備して構成される半導体装置用ソケット。

【請求項2】 前記半導体装置を収容する半導体装置収容部内に設けられる前記コンタクトシート押圧部材が、前記押圧部材と一体に形成されることを特徴とする請求項1記載の半導体装置用ソケット。

【請求項3】 弾性を有する弾性シートが前記コンタクトシートの真下に配されることを特徴とする請求項1記載の半導体装置用ソケット。

【請求項4】 半導体装置の端子群に電気的に接続されるバンプ群を有し、 * 該半導体装置に対する信号の入出力を行なうコンタクトシートと、

前記半導体装置の端子を前記コンタクトシートのバンプ群に対し押圧する押圧 部材と、

前記コンタクトシートにおけるバンプ群に対向して形成され、前記押圧部材に より押圧されるときの該バンプ群の沈下量を調整する沈下量調整部と、

を具備して構成される半導体装置用ソケット。

【請求項5】 弾性を有する弾性シートが前記コンタクトシートの真下に配されることを特徴とする請求項4記載の半導体装置用ソケット。

【請求項6】 前記沈下量調整部は、前記コンタクトシートの表層部に、前記バンプ群に対向して凸状に形成される座面部であることを特徴とする請求項4記載の半導体装置用ソケット。

【請求項7】 前記沈下量調整部は、前記半導体装置を前記コンタクトシー

トを介して収容する収容部の底部に、前記バンプ群に対向して凸状に形成される 座面部であることを特徴とする請求項4記載の半導体装置用ソケット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、コンタクトシートを備える半導体装置用ソケットに関する。

[0002]

【従来の技術】

電子機器などに実装される半導体装置は、実装される以前の段階で種々の試験が行われその潜在的欠陥が除去される。その試験は、熱的および機械的環境試験などに対応した電圧ストレス印加、高温動作、高温保存などにより非破壊的に実施される。その種々の試験のうちで初期動作不良集積回路の除去に有効とされる試験として、高温条件のもとで一定時間の動作試験を行うバーンイン(burn

[0003]

in)試験が行われている。

このバーンイン試験に用いられる検査治具は、一般に、ICソケットと称されている。半導体装置の中で、テストされた良品ベアチップであるKGD(Known Good Die)の試験においては、特願2002-200459号の明細書および特許文献1にも示されるように、そのようなベアチップがICソケットの収容部に対して着脱可能とされるキャリアにより、ICソケットの収容部に装着されることが提案されている。

[0004]

キャリアユニットは、例えば、図14に示されるように、ベアチップ12が収容される収容部2Aを有するキャリアハウジング2と、キャリアハウジング2の収容部2A内側の底部に弾性シート4を介して配されるコンタクトシート6と、ベアチップ12の電極群をコンタクトシート6のバンプ群6Bに対して押圧する押圧用蓋14と、押圧用蓋14をキャリアハウジング2に選択的に保持するラッチ機構10とを含んで構成されている。

[0005]

コンタクトシート6は、図14に示されるように、電気的に接続されるベアチップ12の電極群に対向して銅等で形成される複数のバンプ6Bからなるバンプ群を有している。複数のバンプ6Bは、例えば、その電極群に対応するように額縁状に配列されている。各バンプの先端は、そのコンタクトシート6の表面から所定の高さだけ突出している。なお、図14においては、図面を簡略化するためにバンプ群のうちの二つのバンプ6Bを代表して示す。

[0006]

押圧用蓋14は、ベアチップ12の電極群が形成される面に対向する面に当接する押圧面を有する押圧体16と、押圧体16の基部を収容する蓋本体20と、押圧体16の基部と蓋本体20の凹部を形成する内面との間の空間に配され押圧体16をベアチップ12に向けて付勢する複数のスプリング18とを含んで構成されている。

[0007]

押圧体16の基部は、爪部を外周部に有し蓋本体20の凹部内に移動可能に挿入されている。蓋本体20は、図14に示されるように、その両端部の外面にそれぞれ、ラッチ機構10のフック部材10FAおよび10FBの先端がそれぞれ係合される段差部20Nを有している。

[0008]

ラッチ機構10は、キャリアハウジング2に回動可能に支持され押圧用蓋14の蓋本体20の段差部20Nにそれぞれ係合されるフック部材10FAおよび10FBと、フック部材10FAおよび10FBを蓋本体20の段差部20Nに係合する方向に付勢するねじりコイルばね(不図示)とを含んで構成されている。

[0009]

従って、押圧用蓋14を、予めコンタクトシート6のバンプ6Bに対して位置 決めされたベアチップ12上に配置するにあたっては、図15に示されるように 、押圧用蓋14の蓋本体20の段差部の端部によりラッチ機構10のフック部材 10FAおよび10FBの先端が互いに離隔する方向に回動され、押圧用蓋14 の押圧体16が収容部2Aに収容される。

[0010]

押圧用蓋14がキャリアハウジング2の収容部2A内に装着されるとき、蓋本体20は、その外周部がキャリアハウジング2に設けられるガイド部材8に案内されてキャリアハウジング2の収容部2Aに装着される。その後、ねじりコイルばねにより付勢されることにより、図14に示されるように、ラッチ機構10のフック部材10FAおよび10FBの先端が互いに近接する方向に回動され蓋本体20の段差部20Nの上面に係合される。その結果、押圧用蓋14がキャリアハウジング2に保持されることとなる。

[0011]

【特許文献1】

特開平9-17539号公報

[0012]

【発明が解決しようとする課題】

上述のような各バンプ6Bは、その直径および突出高さが、例えば、1対1の 割合で形成されているのでベアチップ12の電極群の高密度化に伴ない各バンプ 6Bの直径が小となるにつれて各バンプ6Bの突出高さも小となる。

[0013]

従って、コンタクトシート6における弾性シート4に対向するバンプ群近傍が図16に部分的に拡大されて示されるように、その弾性力に抗して沈下した場合、ベアチップ12の外周縁部が図14に示されるように、コンタクトシート6の表面に形成される銅製の導体層に接触することより傷つけられる虞がある。また、コンタクトシート6におけるバンプ群とベアチップ12の電極群との接触圧が所定値以下に低下する虞もある。

[0014]

以上の問題点を考慮し、本発明は、コンタクトシートを備える半導体装置用ソケットであって、ベアチップの電極群の高密度化に伴うコンタクトシートにおけるバンプ群近傍の沈下によるベアチップとコンタクトシートとの接触を抑制することができる半導体装置用ソケットを提供することを目的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】

上述の目的を達成するために、本発明に係る半導体装置用ソケットは、半導体装置の端子群に電気的に接続されるバンプ群を有し、半導体装置に対する信号の入出力を行なうコンタクトシートと、半導体装置の端子をコンタクトシートのバンプ群に対し押圧する押圧部材と、押圧部材により半導体装置の端子がバンプ群に対し押圧されるとき、コンタクトシートにおけるバンプ群の周辺の沈下を抑制する方向に、コンタクトシートを押圧するコンタクトシート押圧部材とを備えて構成される。

[0016]

また、半導体装置を収容する半導体装置収容部内に設けられるコンタクトシート押圧部材が、押圧部材と一体に形成されてもよい。弾性を有する弾性シートがコンタクトシートの真下に配されるものでもよい。

[0017]

さらに、本発明に係る半導体装置用ソケットは、半導体装置の端子群に電気的に接続されるバンプ群を有し、半導体装置に対する信号の入出力を行なうコンタクトシートと、半導体装置の端子をコンタクトシートのバンプ群に対し押圧する押圧部材と、コンタクトシートにおけるバンプ群に対向して形成され、押圧部材により押圧されるときのバンプ群の沈下量を調整する沈下量調整部とを備えて構成される。

[0018]

弾性を有する弾性シートがコンタクトシートの真下に配されるものでもよい。

[0019]

沈下量調整部は、コンタクトシートの表層部に、バンプ群に対向して凸状に形成される座面部でもよい。沈下量調整部は、半導体装置をコンタクトシートを介して収容する収容部の底部に、バンプ群に対向して凸状に形成される座面部であってもよい。

[0020]

【発明の実施の形態】

図6は、本発明に係る半導体装置用ソケットの一例を示す。

[0021]

図6に示される半導体装置用ソケットにおいては、半導体装置としてのベアチップ60が内部に収容されるキャリアユニット40と、キャリアユニット40が 着脱可能に収容部に装着されるICソケット30とを含んで構成されている。

[0022]

ICソケット30は、ベアチップ60への検査信号およびベアチップ60からの検出出力信号等の入出力を行なうプリント配線基板38上に配置され、キャリアユニット40を収容する収容部を有する本体部32と、本体部32に設けられ、キャリアユニット40における構成要素となる後述するコンタクトシート44の各パッドにそれぞれ電気的に接続される複数のコンタクトからなるコンタクト群34と、本体部32に対し昇降動可能に配されコンタクト群34の各接点部をコンタクトシートの各パッドに選択的に電気的に接続するカバー部材36とを主な要素として構成されている。

[0023]

樹脂材料で成形される本体部32は、プリント配線基板38の電極部に対応して所定位置に配置されている。本体部32は、図7に示されるように、キャリアユニット40が収容される収容部32Aを有している。収容部32Aは、後述するキャリアユニット40のベース部の下部に係合される下部基台部32aの内周部と、下部基台部32aに連なりそのベース部の上部に係合される上部基台部32bの内周部とにより包囲されて形成されている。下部基台部32aには、コンタクト群34が支持されている。下部基台部32aには、コンタクト群34を構成する各コンタクト34ai(i=1~n,nは整数)が挿入されるスリットが所定の間隔で紙面に対して垂直方向に沿って形成されている。コンタクト群34は、収容部32Aを囲むように各辺にそれぞれ設けられている。なお、図6および図7においては、収容部32Aの四方を取り囲む4つのコンタクト群34のうちの一辺に対応する部分のみのコンタクト群34を示す

[0024]

各コンタクト34 a i (i = 1 ~ n, n は整数)は、下部基台部32 a に圧入されている端子部34 T と、端子部34 T に連なり後述するコンタクトシート4

4のパッド44Pに下方側から電気的に接続される固定側接点部34fと、弾性を有し端子部34Tに連なりそのパッド44Pに上方側から電気的に接続される可動側接点部34mと、可動側接点部34mから分岐され後述するカバー部材36の斜面部に選択的に係合されて可動側接点部34mを固定側接点部34fに対して離隔する方向に回動させる被係合部34eとを含んで構成されている。

[0025]

各コンタクト34aiは、後述するコンタクトシート44のパッド44Pに対応して紙面に対し略垂直方向に沿って所定の間隔で配列されている。樹脂材料で成形されるカバー部材36は、キャリアユニット40が通過する開口部36aを有している。開口部36aの周縁を形成する枠状部分は、本体部32の外周部に設けられる溝に案内される脚部により、昇降動可能に支持されている。なお、カバー部材36は、図示が省略される弾性部材により、本体部32に対し離隔する方向に付勢されている。その枠状部分の各辺の下端には、斜面部36sがそれぞれ形成されている。斜面部36sは、図6において二点鎖線で示されるように、カバー部材36が所定位置まで下降せしめられるとき、上述の各コンタクト34aiの被係合部34eに係合し可動側接点部34mをその弾性力に抗して固定側接点部34fに対して離隔する方向に回動させる。

[0026]

後述するキャリアユニット40がICソケット30の本体部32の収容部32 Aに装着される場合、カバー部材36が所定量、押し下げ保持されることにより、コンタクト群34の各可動接点部34mが収容部32Aに対し待機せしめられた後、キャリアユニット40が上方から開口部36aを介して収容部32A内に位置決めされ載置される。その際、固定側接点部34fは、キャリアユニット40におけるコンタクトシート44のパッド44Pの下面側に当接せしめられる。

[0027]

続いて、保持された状態のカバー部材36が解放されるとき、上述の弾性体の 復帰力、および各コンタクト34aiの被係合部34eの弾性力の合力によりカ バー部材36が上昇せしめられる。その際、コンタクト群34の各可動接点部3 4mは、元の位置に戻され、キャリアユニット40のコンタクトシート44のパ ッド44Pの上面側に当接せしめられる。それにより、図6に示されるように、 コンタクトシート44と4つのコンタクト群34とが電気的に接続されることに なる。

[0028]

キャリアユニット40は、図7に示されるように、ベアチップ60が収容される収容部46Aを有するキャリアハウジング46と、キャリアハウジング46の収容部46Aの底部を形成するベース部材42上にゴム材料で作られる弾性シート58を介して配されるコンタクトシート44と、ベアチップ60の電極群をコンタクトシート44のバンプ群44Bに対して押圧する押圧体を含んでなる押圧用蓋52と、押圧用蓋52をキャリアハウジング46に選択的に保持するラッチ機構50とを含んで構成されている。

[0029]

ラッチ機構50は、キャリアハウジング46の両端にそれぞれ、回動可能に支持され押圧用蓋52の蓋本体を保持するフック部材48Aおよび48Bと、フック部材48Aおよび48Bをそれぞれ、図7において矢印の示す方向、即ち、蓋本体の突起部に係合させる方向に付勢するねじりコイルばね66と、フック部材48A、48B、およびねじりコイルばね66を支持する支持軸68とを含んで構成されている。

[0030]

キャリアハウジング46の両端部には、押圧用蓋52が装着されるとき、蓋本体64の下部の外周部を案内するガイド部46gが形成されている。ガイド部46gの周囲には、支持軸68の両端部が支持されている。

[0031]

コンタクトシート44は、図1に部分的に拡大され模式的に示されるように、電気的に接続されるベアチップ60の電極群に対応した配列で複数のバンプ44 Bを基材44M内に有している。例えば、銅等で形成される各バンプ44Bの根元は、約100 μ m程度の直径を有するとともに、その基材44Mの表面から所定の高さ、例えば、約50 μ mだけ突出している。基材44Mは、例えば、ポリイミド樹脂材料で薄板状に作られ、約数十 μ m程度の厚さを有している。

[0032]

各バンプ44Bは、銅箔で作られる導体層44cを介して各パッド44pに接続されている。複数のパッド44pは、図6に示されるように、基材44Mにおいてベース部材42の両端部からそれぞれ、外部に向けて突出する両端部に形成されている。

[0033]

押圧用蓋52は、図1および図2に示されるように、ベアチップ60の上面に 当接する押圧面56aを有する押圧体56と、押圧体56の基部を収容する蓋本 体64と、押圧体56の基部の凹部56rと蓋本体64の凹部64rとの間の空 間に配され押圧体56をベアチップ60に向けて付勢する複数のスプリング54 とを含んで構成されている。なお、図2は、押圧用蓋52の押圧状態を示す。

[0034]

略正方形のベアチップ60は、例えば、所定の電極群をコンタクトシート44 のバンプに対向する下面に有している。

[0035]

蓋本体64は、図1に示されるように、その外周部に、ラッチ機構50のフック部材48Aおよび48Bがそれぞれ係合される突起部64pを有している。 凹部64rが開口する蓋本体64の凹部内には、コンタクトシート押圧部材としての板状片64tが複数箇所に蓋本体64と一体に形成されている。所定の板厚を有する板状片64tは、例えば、図5に示されるように、ベアチップ60の各辺に対応して4ヶ所に押圧体56の基部に対し略垂直に交差するように設けられている。各板状片64tは、ベアチップ60の各辺の端部との間に所定の隙間CL、例えば、約0.1mm以上1mm以下程度の隙間が形成されるように設定されている。また、各板状片64tの突出長さは、例えば、図1に示されるように、押圧体56の基部のスリット56sを貫通しコンタクトシート44の基材44Mを押圧時、図4に拡大されて示されるように、コンタクトシート44の基材44Mの表面がバンプ44Bの突出高さ分だけ沈むように設定されている。

[0036]

押圧体56の基部は、蓋本体64の凹部内に移動可能に挿入されている。押圧

体56における凹部内に挿入される部分の端部には、蓋本体64の下端に設けられる爪部64nに係合される爪部56nが相対向して複数個形成されている。これにより、押圧体56が弾性体、例えば、スプリング54の付勢力で付勢された状態で蓋本体64の内側に保持されることとなる。

[0037]

かかる構成において、キャリアユニット40内にベアチップ60を装着するに あたっては、先ず、ベアチップ60の電極群がコンタクトシート44のバンプ4 4Bに対して位置決めされ、ベアチップ60の電極群がバンプ44Bに当接する ように配置される。

[0038]

次に、押圧用蓋52がキャリアハウジング46の収容部46A内に挿入される。その際、ねじりコイルばね66の付勢力に抗してラッチ機構50のフック部材48Aおよび48Bの先端が互いに離隔する方向に回動される。また、蓋本体64の外周面がガイド部46gの内面に案内されつつ、押圧体56の押圧面56aがスプリング54の付勢力に抗してベアチップ60の上面に押し付けられる。

[0039]

その際、コンタクトシート44の基材44Mにおけるベアチップ60の各辺の端部近傍が、図1および図4に示されるように、各板状片64tの一端により押圧されるので沈下せしめられることとなる。従って、コンタクトシート44の基材44Mの表面に形成される導体層44cとベアチップ60の端部との干渉が回避されることとなる。

[0040]

続いて、ねじりコイルばね66の付勢力により、フック部材48の先端が互い に近接する方向に回動され蓋本体64の突起部64pに係合される。その結果、 押圧用蓋52が図1に示されるように、キャリアハウジング46に保持されるこ ととなる。

[0041]

図8は、本発明に係る半導体装置用ソケットの一例に用いられるキャリアユニットの他の一例を示す。なお、図8においては、図1に示される例において同一

とされる構成要素について同一の符号を付して示し、その重複説明を省略する。

[0042]

図8に示されるキャリアユニットは、図1に示されるようなベアチップ60が収容される収容部46Aを有するキャリアハウジング46と、キャリアハウジング46の収容部46Aの底部を形成するベース部材42上に弾性シート58を介して配されるコンタクトシート70と、ベアチップ60の電極群をコンタクトシート70のバンプ群70Bに対して押圧する押圧体を含んでなる押圧用蓋72と、押圧用蓋72をキャリアハウジング46に選択的に保持するラッチ機構50とを含んで構成されている。

[0043]

コンタクトシート70は、図9に示されるように、電気的に接続されるベアチップ60の電極群に対応した配列で複数のバンプ70Bを基材70M内に有している。例えば、銅等で形成される各バンプ70Bの根元は、約100 μ m程度の直径を有するとともに、その基材70Mの表面から所定の高さ、例えば、約50 μ mだけ突出している。基材70Mは、例えば、ポリイミド樹脂材料で薄板状に作られ、約数十 μ m程度の厚さを有している。

[0044]

各バンプ70Bは、銅箔で作られる導体層を介して各パッド(不図示)に接続されている。複数のパッドは、基材70Mにおいてベース部材42の両端部からそれぞれ、外部に向けて突出する両端部に形成されている。

[0045]

基材70Mの弾性シート58に対向する面における各バンプ70Bの配列に対応する部分には、図10に示されるように、各バンプ70Bの沈下量を調整する沈下調整部として凸状の座面部70dが所定の幅の枠状に形成されている。座面部70dは、例えば、樹脂、金属、もしくはレジストにより突起状に形成されている。その突出高さは、図9に示されるように、押圧力が作用していないとき、コンタクトシート70の表面と弾性シート58の表面との間に所定の隙間Sが形成されるように例えば、各バンプ70Bの沈下量に応じて5μm以上200μm以下に設定されている。

[0046]

押圧用蓋72は、図8に示されるように、ベアチップ60の上面に当接する押圧面78aを有する押圧体78と、押圧体78の基部を収容する蓋本体76と、押圧体78の基部の凹部78rと蓋本体76の凹部76rとの間の空間に配され押圧体78をベアチップ60に向けて付勢する複数のスプリング74とを含んで構成されている。なお、図8は、押圧用蓋72の押圧状態を示す。

[0047]

蓋本体76は、図8に示されるように、その外周部に、ラッチ機構50のフック部材48Aおよび48Bがそれぞれ係合される突起部76pを有している。

[0048]

押圧体78の基部は、凹部76rが開口する蓋本体76の凹部内に移動可能に 挿入されている。押圧体78における凹部内に挿入される部分の端部には、蓋本 体76の下端に設けられる爪部76nに係合される爪部78nが相対向して複数 個形成されている。これにより、押圧体78がスプリング74の付勢力で付勢さ れた状態で蓋本体76の内側に保持されることとなる。

[0049]

斯かる構成において、キャリアユニット内にベアチップ60を装着するにあたっては、先ず、図9に示されるように、ベアチップ60の電極群がコンタクトシート70のバンプ70Bに対して位置決めされ、ベアチップ60の電極群がバンプ70Bに当接するように配置される。

[0050]

次に、押圧用蓋72がキャリアハウジング46の収容部46A内に挿入される。その際、ねじりコイルばねの付勢力に抗してラッチ機構50のフック部材48Aおよび48Bの先端が互いに離隔する方向に回動される。また、蓋本体76の外周面がガイド部46gの内面に案内されつつ、押圧体78の押圧面78aがスプリング74の付勢力に抗してベアチップ60の上面に押し付けられる。

[0051]

その際、コンタクトシート70の表面と弾性シート58の表面との間に形成される所定の隙間Sがなくなるとともに、コンタクトシート70の基材70Mにお

けるバンプ70B近傍のみの沈下量が所定値以上となることが抑制されることにより、基材70Mの導体層とベアチップ60の端部との干渉が回避されることとなる。

[0052]

続いて、ねじりコイルばね66の付勢力により、フック部材48Aおよび48 Bの先端が互いに近接する方向に回動され蓋本体76の突起部76pに係合される。その結果、図8に示されるように、押圧用蓋72がキャリアハウジング46 に保持されることとなる。

[0053]

図11は、本発明に係る半導体装置用ソケットの一例に用いられるキャリアユニットのさらなる他の一例を示す。なお、図11においては、図8に示される例において同一とされる構成要素について同一の符号を付して示し、その重複説明を省略する。

[0054]

図11に示されるキャリアユニットは、図8に示されるようなベアチップ60が収容される収容部46Aを有するキャリアハウジング46と、キャリアハウジング46の収容部46Aの底部を形成するベース部材82上に弾性シート58を介して配されるコンタクトシート80と、ベアチップ60の電極群をコンタクトシート80のバンプ群80Bに対して押圧する押圧体を含んでなる押圧用蓋72と、押圧用蓋72をキャリアハウジング46に選択的に保持するラッチ機構50とを含んで構成されている。

[0055]

コンタクトシート80は、図11に示されるように、電気的に接続されるベアチップ60の電極群に対応した配列で複数のバンプ70Bを基材80M内に有している。例えば、銅等で形成される各バンプ80Bの根元は、約100μm程度の直径を有するとともに、その基材80Mの表面から所定の高さ、例えば、約50μmだけ突出している。基材80Mは、例えば、ポリイミド樹脂材料で薄板状に作られ、約数十μm程度の厚さを有している。

[0056]

各バンプ80Bは、銅箔で作られる導体層を介して各パッド(不図示)に接続されている。複数のパッドは、基材80Mにおいてベース部材82の両端部からそれぞれ、外部に向けて突出する両端部に形成されている。

[0057]

ベース部材82における弾性シート58が配置される部分であって、基材80 Mの各バンプ80Bの配列に対応する部分には、図12に示されるように、各バンプ80Bの沈下量を調整する沈下調整部として凸状の座面部82dが所定の幅の枠状に一体に形成されている。座面部82dは、例えば、ベース部材82の材料と同一の樹脂材料で作られている。その突出高さは、図12に示されるように、押圧力が作用していないとき、コンタクトシート80の表面と弾性シート58の表面との間に所定の隙間Sが形成されるように例えば、各バンプ70Bの沈下量に応じて5μm以上200μm以下に設定されている。なお、斯かる例に限られることなく、例えば、座面部82dが、ベース部材82と別体に形成され配置されてもよい。

[0058]

斯かる構成において、キャリアユニット内にベアチップ60を装着するにあたっては、先ず、図12に示されるように、ベアチップ60の電極群がコンタクトシート80のバンプ80Bに対して位置決めされ、ベアチップ60の電極群がバンプ80Bに当接するように配置される。

[0059]

次に、押圧用蓋72がキャリアハウジング46の収容部46A内に挿入される。その際、ねじりコイルばねの付勢力に抗してラッチ機構50のフック部材48Aおよび48Bの先端が互いに離隔する方向に回動される。また、蓋本体76の外周面がガイド部46gの内面に案内されつつ、押圧体78の押圧面78aがスプリング74の付勢力に抗してベアチップ60の上面に押し付けられる。

[0060]

その際、コンタクトシート80の表面と弾性シート58の表面との間に形成される所定の隙間Sがなくなるとともに、コンタクトシート80の基材80Mにおけるバンプ80B近傍のみの沈下量が所定値以上となることが抑制されることに

より、基材80Mの導体層とベアチップ60の端部との干渉が回避されることとなる。

[0061]

続いて、ねじりコイルばね66の付勢力により、フック部材48Aおよび48 Bの先端が互いに近接する方向に回動され蓋本体76の突起部76pに係合される。その結果、押圧用蓋72がキャリアハウジング46に保持されることとなる

[0062]

【発明の効果】

以上の説明から明らかなように、本発明に係る半導体装置用ソケットによれば、押圧部材により半導体装置の端子が前記バンプ群に対し押圧されるとき、コンタクトシートにおけるバンプ群の周辺の沈下を抑制する方向に、コンタクトシートを押圧するコンタクトシート押圧部材が設けられるのでバンプ群の周辺の沈下が抑制されることにより、ベアチップの電極群の高密度化に伴うコンタクトシートにおけるバンプ群近傍の沈下によるベアチップとコンタクトシートとの接触を抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る半導体装置用ソケットの一例に用いられるキャリアユニットの一 例の構成を示す構成図である。

【図2】

図1に示されるキャリアユニットにおける押圧蓋の構成を示す構成図である。

【図3】

図2に示される例における平面図である。

【図4】

図1に示される例における要部を拡大して部分的に示す断面図である。

【図5】

図1に示される例におけるコンタクトシートの平面図である。

【図6】

本発明に係る半導体装置用ソケットの一例の全体構成を概略的に示す構成図である。

【図7】

図6に示される例において、分解して全体構成を概略的に示す構成図である。

【図8】

本発明に係る半導体装置用ソケットの一例に用いられるキャリアユニットの他 の一例の構成を示す構成図である。

【図9】

図8に示される例における動作説明に供される構成図である。

【図10】

図8に示される例におけるコンタクトシートの平面図である。

【図11】

本発明に係る半導体装置用ソケットの一例に用いられるキャリアユニットのさらなる他の一例の構成を示す構成図である。

【図12】

図11に示される例における動作説明に供される構成図である。

【図13】

図11に示される例におけるベース部材の平面図である。

【図14】

従来の半導体装置用ソケットに用いられるキャリアユニットの構成を示す構成 図である。

【図15】

図14に示される例における動作説明に供される構成図である。

【図16】

図14に示される例におけるコンタクトシートの一部を拡大し部分的に示す断 面図である。

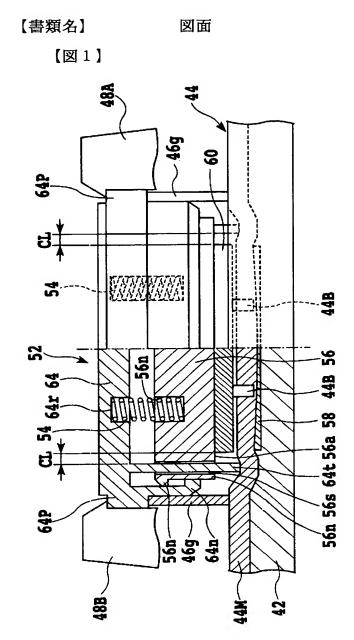
【符号の説明】

44、70、80 コンタクトシート

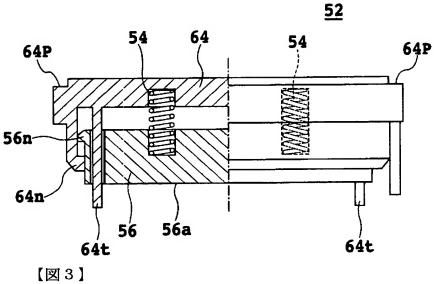
44B、70B、80B バンプ群

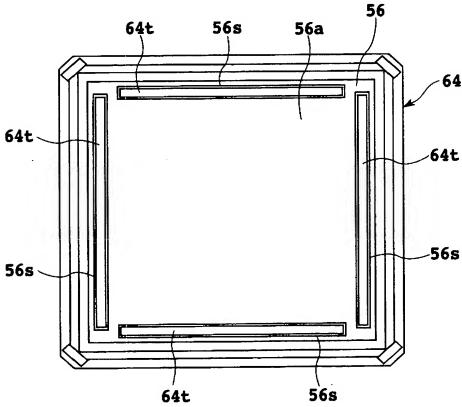
特2003-004977

- 46 キャリアハウジング
- 4 6 A 収容部
- 52、72 押圧用蓋
- 58 弾性シート
- 60 ベアチップ
- 6 4 蓋本体
- 64t 板状片
- 70d、82d 座面部

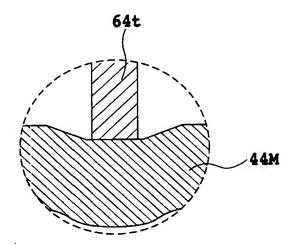


【図2】

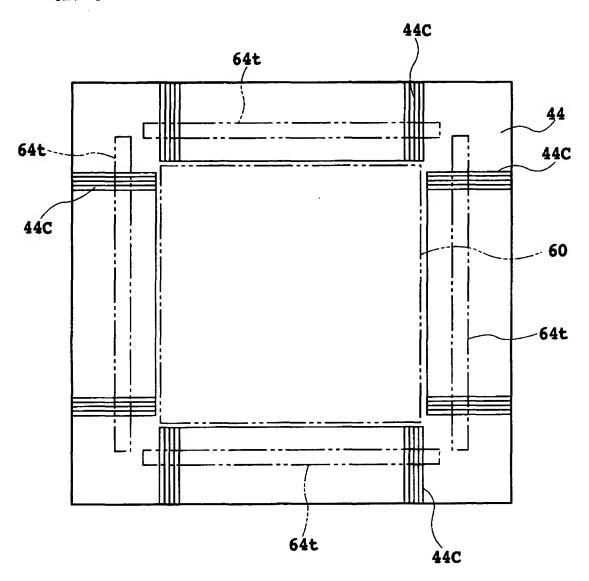




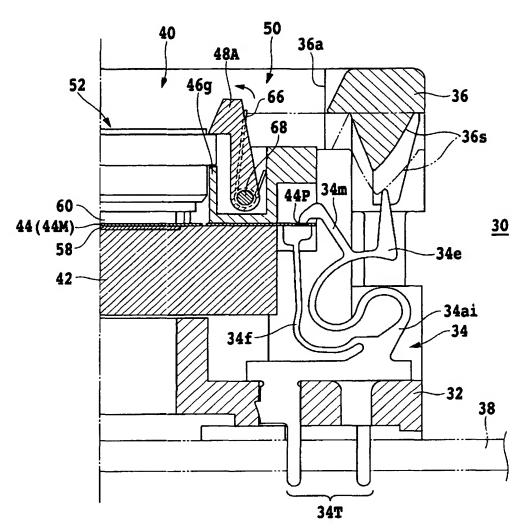
【図4】

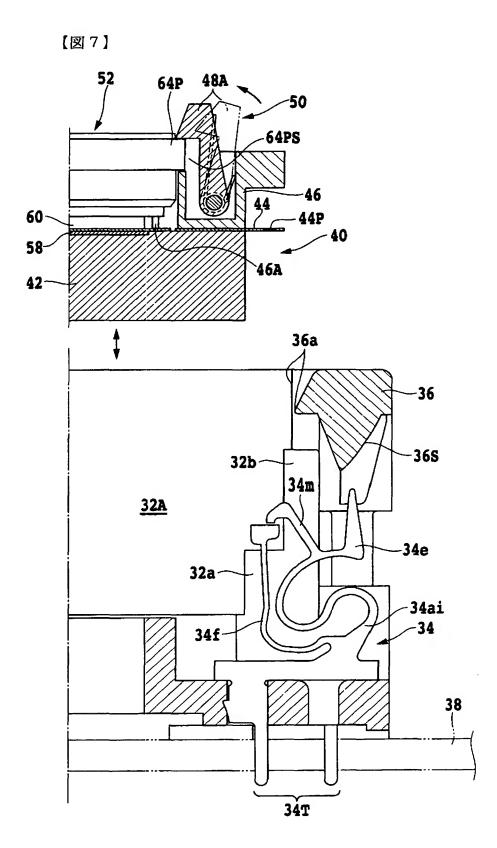


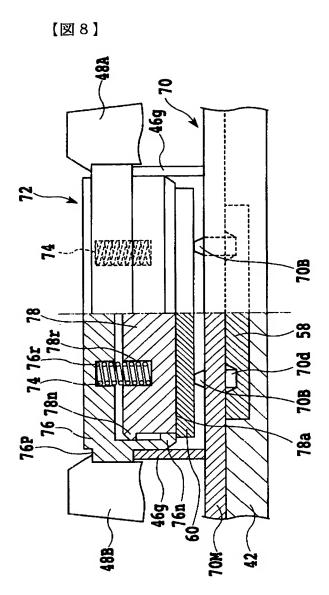
【図5】



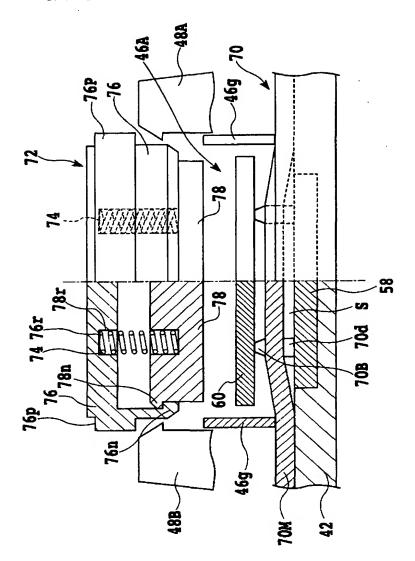
【図6】



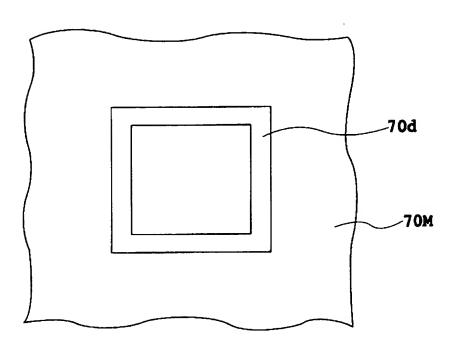




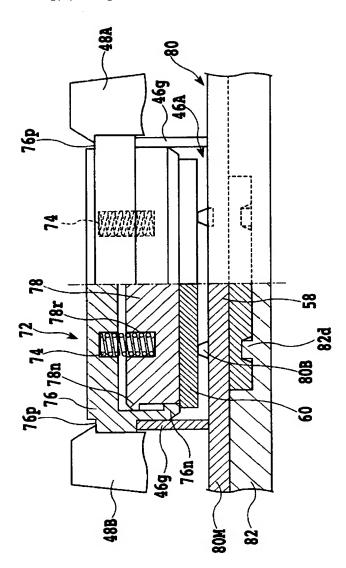
【図9】



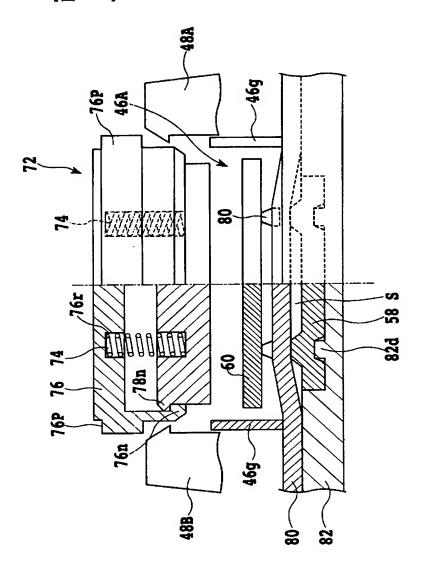
【図10】



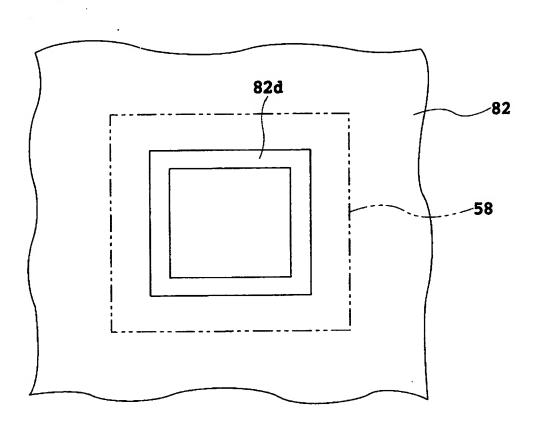
【図11】



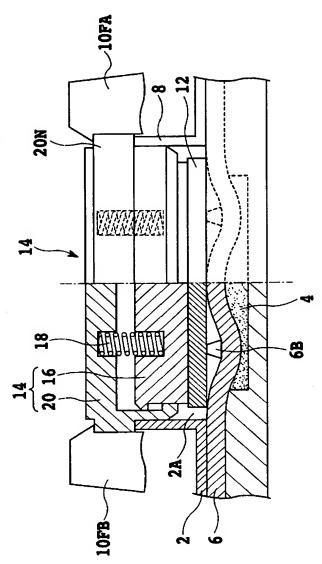
【図12】



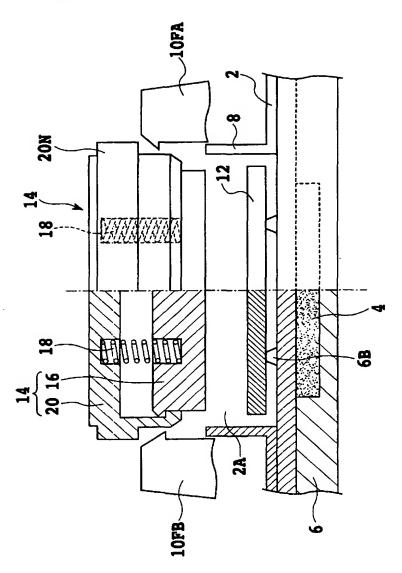
【図13】



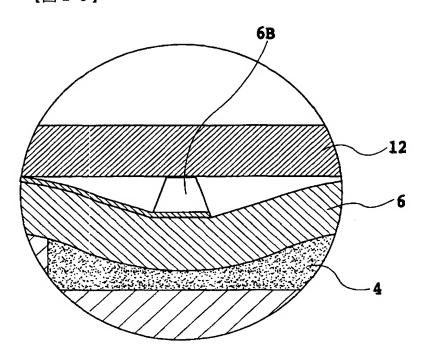
【図14】



【図15】



【図16】



特2003-004977

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ベアチップの電極群の高密度化に伴うコンタクトシートにおけるバン プ群近傍の沈下によるベアチップとコンタクトシートとの接触を抑制することが できること。

【解決手段】 押圧用蓋の蓋本体 6 4 が、コンタクトシート 4 4 の基材 4 4 Mにおけるベアチップ 6 0 の各辺の端が配置される部位を押圧する板状片 6 4 t を備えるもの。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000177690]

1. 変更年月日 1991年 2月26日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都大田区中馬込3丁目28番7号

氏 名 山一電機株式会社